# イオン蓄積リングS-LSRの偏向電磁石磁場測定

池上将弘<sup>A)</sup>、Hicham Fadil<sup>A)</sup>、渋谷 真二<sup>B)</sup>、竹内 猛<sup>B)</sup>、野田 章<sup>A)</sup>、
野田 耕司<sup>B)</sup>、小川 博嗣<sup>B)</sup>、白井 敏之<sup>A)</sup>、頓宮 拓<sup>A)</sup>
<sup>A)</sup>京都大学化学研究所附属原子核科学研究施設 〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄
<sup>B)</sup>放射線医学総合研究所 〒263-8555 千葉市稲毛区穴川 4-9-1

### 概要

イオン蓄積リングS-LSR用の偏向電磁石は全台数 の製作が完了し、磁場測定による性能評価の段階にある。 磁場測定はホール素子によるマッピングで行い、三次元磁 場計算コード TOSCA による計算結果と実際の磁場分布に 大きな相違がないか調べる。また、各電磁石の磁場分布の 個体差を評価しリング上での最適な配置を決定する。 S-LSR の新たな試みの一つとして、偏向磁石のギャップ内 のビーム設計軌道に沿って円筒形電極を設置し、磁場と電 場の重畳によって運動量分散関数の制御を行うというこ とがある[1]。これを実現するためには磁場と電場の有効長 を正確に揃える必要がある。S-LSRリング上では偏向 磁石と四重極磁石の磁極端の間隔が 200mmになっており、 偏向磁石のギャップ 70mm、四重極磁石のボア半径 70m mと比較して非常に近い位置に設置されることになる。偏 向磁石側にはフィールドクランプが取り付けられている が、四重極磁石の磁場の影響で偏向磁場の有効長が計算値 からずれる可能性がある。これも磁場測定によって評価す る。

## 1 偏向電磁石の設計

### 1.1 設計の目標

**S-LSR** の偏向電磁石は中心軌道から水平方向に±100m mの範囲で磁場の平坦度を±1×10<sup>-4</sup> 以内に収めることを 目標に設計された。

	仕様
鉄芯形状	H型
台数	6
最大磁場	0.95T
曲率半径	1050mm
ギャップ幅	70mm
偏向角	$60^{\circ}$
エッジ角	$0^{\circ}$
磁極端部カット	ロゴスキーカット
鉄芯材質	電磁軟鉄
主コイル	鞍型と鉢巻型の組み合わせ
最大コイル電流	27000A・ターン
質量	4.5t

また、ギャップ内には電極が設置され運動量分散関数の 制御を行う。電極には駆動機構が組み込まれ、S-LSR は大 きな水平方向のアパーチャーを持った通常の磁場のみを 用いた蓄積リングとしても、電磁場により運動量分散関数 を調整可能なリングとしても利用できるようになってい る。S-LSR の仕様は表1の様になっている。図1 のように リング上では偏向磁石と四重極磁石の間隔は 200mm と狭 い。互いの fringing field の影響を軽減するため、フィール ドクランプ用鉄板が設置されている。



図1.リング上での偏向磁石と四重極磁石の配置。ビー ム進行方向の座標をs、曲率半径方向の座標をrとする。

#### 1.2 二次元磁場計算

r 方向の磁場分布の傾きを補正するためにコイルの上 ヨークの厚みは内側と外側で変えてある。また、できるだ け狭い磁極幅で±100mmの磁場の有効領域を得るため図 2のように磁極端部にシムを設けた。



図2 r 方向磁極断面形状

さらに、励磁電流が上がったときに鉄の飽和によって磁 場分布が変わることがないように磁極の角は丸くカット されている。同様に、励磁電流によってs方向の有効磁極 長が変化しないようにビームの出入口側の磁極端部にロ ゴスキーカットを入れ、さらにその外側のフィールドクラ ンプの存在も考慮に入れs方向の2次元磁場計算を行った。 (図3)



図3. POISSON によるs方向の2次元磁場計算。リタ ーンヨークを再現するため鉄芯、フィールドクラ ンプ上部には透磁率が無限大の物質を付けてあ る。

#### 1.3 三次元磁場計算

三次元計算はシミュレーションコード TOSCA を用いて 行った。三次元磁場計算の目的の一つは二次元磁場計算と の比較を行うことによって双方の計算結果が正しいこと を確かめることである。ギャップの奥の磁極中心付近の r 方向の磁場分布の三次元計算結果と二次元磁場計算結果 を比較したものを図4に示す



図4.二次元磁場計算結果と三次元磁場計算結果の比較。 両者はよく一致していることが分かる。

図3に示した二次元磁場計算は中心軌道付近の有効磁極 長の評価に対応する。中心軌道から離れた所での有効磁極 長を二次元計算で評価することは難しい。有効磁極長と実 際の磁極長の差の  $1/2 \epsilon \Delta L$  (r) と置き、三次元計算で これを評価した。磁極中心付近の r 方向の磁場分布は図4 に示すように、中心軌道から±100mmの範囲でほとんど一 様である。しかし、ビームの出入口付近のロゴスキーカッ トのある部分では次第にギャップ広がっていく上に、図5 に示すようにロゴスキーカットの部分にはシムがないの で、ビームの出入口付近でのr方向の磁場分布は中心軌道 から離れるにつれて磁場が弱くなり、いわゆる6極磁場成 分を多く含む磁場分布になる。このビーム出入口付近の6 極磁場成分がBL積にも現れ、BL積はビーム軌道中心か ら離れるにつれて小さくなり、ΔL(r)もrによって変 化する。ΔLがrに依らず一定の値をとるようにするため にロゴスキーカットの最後の二段に図5に示すようなカッ トを入れた。



図5. ビーム出入口側磁極端部のカット形状

このカットによりビーム中心軌道付近の実際の磁極長 が短くなる。そのためビームの軌道中心に近いところでは BL積が小さくなりΔL(r)は一定になるように補正さ れる。(図6)



図 6. Δ L の r 方向分布

運動量分散関数を制御する際には磁場と電場を同時に 使用するが、その際に電場と磁場の有効長がそろっている ことが望ましい。電場の場合は電極にかける電圧を変えて も有効長が変化することはない。磁場の場合も一般に磁極 端部にロゴスキーカットがあれば有効磁極長が励磁によ って変化することはない。しかし、今回設計した磁石には フィールドクランプが設けられており、フィールドクラン プも有効磁極長に大きな影響を与える[2][3]。フィールドク ランプの大きさが十分でなければ、励磁電流が大きい時に はフィールドクランプの鉄が飽和し、フリンジの磁場の様 子が変わり有効磁極長も変わってしまう。図7はフィール ドクランプの大きさ、形状を最適化する前と後でのΔL (r)の励磁による変化の様子を表している。フィールド クランプを最適化するとΔLは励磁によって変化するこ とがほとんどなくなった。



図7. △L(r)の励磁による変化。フィールドクランプ の形状、大きさを最適化すると△Lは励磁電流に依 らなくなった。

# 2 磁場測定

#### 2.1 磁場測定の目的

実際に製作した電磁石(図8)が作る磁場と三次元磁場 計算による磁場の設計値に大きなずれがないかどうか確 かめるために磁場測定を行う。また測定結果から各電磁石 の個体差を評価しリング上での六台の最適な配置を考え る。残留磁場による影響も調べ実際に使用する際の励磁の 順序を決める。フィールドクランプは偏向電磁石単体では 励磁が最高のときでも飽和しないように設計されている。 しかし、すぐ近くにある四重極磁石の磁場の影響は磁場計 算の際に考慮されていない。



図8.製作した偏向電磁石と四重極磁石の実際の位置関係。 フィールドクランプのすぐ横に四重極磁石が設置さ れる。

四重極磁石が励磁されていると中心軌道から離れた所 では偏向電磁石と同じ鉛直方向の磁場成分が多く現れる。 そのためフィールドクランプの左右のいずれかの部分の 鉄が飽和する可能性がある。すると、図6. 図7に示した ようなΔLの分布の内側と外側の対称性が崩れる可能性 がある。またフィールドクランプの鉄が飽和すると有効磁 極長も計算値からずれ、電場の有効長と一致しなくなる可 能性がある。電極は現在設計段階にあるためできるだけ早 く四重極磁石が偏向電磁石の有効磁極長に与える影響を 調べ設計に反映させる必要がある。

#### 2.2 磁場測定計画

磁場測定はホール素子によるマッピングで行う。測定範 囲は図9に示す範囲で、①は四重極磁石の磁場の影響を調 べるとき、②は偏向電磁石単体の磁場の様子を調べるとき の測定範囲である。②の場合は四重極磁石は置かない。座 標系は直交座標である。



図9.磁場測定範囲。フィールドクランプが存在するため に磁極の中心まで磁場を測定する場合には磁石 10°傾けて置く必要がある

測定する磁場成分は鉛直成分と測定範囲①、②の水平方 向成分である。測定は直交座標上で行うため水平方向成分 はビームに対する磁場の影響の評価には使えないが、磁場 の中央面を出すときに利用する。水平方向成分が最も小さ い平面を中央面とする。中央面から上下にずれた平面上で も磁場を測定し磁場の鉛直方向の対称性も確認する予定 である。

# 参考文献

- [1] M. Ikegami et al, Phys. Rev. ST-AB, 投稿予定
- [2] T.Hori et al INS-NUMA-24 (1980)
- [3] M.Ikegami et al, BEAM SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol.8, February 2003, 5